

5 июня 2018 г.

Открытие конференции

- 10.30-10.35 **В.Н. Улимов – Председатель оргкомитета**
(5 мин.) АО «НИИП»
Открытие конференции
- 10.35-10.40 **А.В. Яненко – Зам. председателя оргкомитета**
(5 мин.) АО «ЭНПО СПЭЛС»
Научно-техническая программа конференции

Устные доклады

1. 10.40-11.00 **А.А. Смолин, А.И. Чумаков, А.В. Согоян, А.В. Яненко**
(20 мин.) НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методика прогнозирования частоты одиночных радиационных эффектов, основанная на двухпараметрической модели
2. 11.10-11.30 **Р.Г. Усеинов¹, В.М. Ужегов²**
(20 мин.) ¹АО «НИИП», ²ФГУП «ЦНИИмаш»
Методика оценки стойкости ИС к отказам от ТЗЧ в космическом пространстве по ограниченному набору экспериментальных данных для сечений защелок
3. 11.40-12.00 **В.С. Анашин, Г.А. Протопопов, Е.В. Мрозовская**
(20 мин.) Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Анализ методов интерпретации результатов испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ

Перерыв 12.00-13.00 (кофе-брейк)

4. 13.00-13.20 **С.Н. Маслова-Зарецкая**
(20 мин.) АО «НИИП»
Метрологическое обеспечение испытаний в АО «НИИП»
5. 13.30-13.50 **В.С. Першенков, И.И. Максимов, А.И. Жуков**
(20 мин.) НИЯУ МИФИ
Учет заряда радиационно-индуцированных акцепторных и донорных ловушек при расчете тока поверхностной рекомбинации биполярных транзисторов
6. 14.00-14.20 **В.С. Анашин, П.А. Чубунов, А.Е. Козюков, А.С. Бычков**
(20 мин.) Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Специфика испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ в условиях модернизации ускорителей ионов

7. 14.30-14.50
(20 мин.) **Н.А. Усачёв, В.В. Елесин, Г.Н. Назарова, Г.В. Чуков, А.Ю. Никифоров, Д.И. Сотсков, В.А. Телец, К.М. Амбуркин, И.О. Метелкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Результаты апробации подхода расчетно-экспериментального прогнозирования и обеспечения радиационной стойкости современной ЭКБ ТСВЧЭ на ранних этапах разработки
- Перерыв 15.00-15.30 (кофе-брейк)**
8. 15.30-15.50
(20 мин.) **Ю.М. Московская**
АО «ЭНПО СПЭЛС»
Базовые методические подходы к контролю соответствия готовой продукции требованиям в процессе серийного производства изделий микроэлектроники различных категорий радиационной стойкости
9. 16.00-16.20
(20 мин.) **П.А. Зимин¹, В.С. Анашин¹, П.А. Чубунов¹, О.В. Мещуров², Р.Г. Усейнов^{2,3}, Г.И. Зебреев³**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²АО «НИИП», ³НИЯУ МИФИ
Усиление скорости захвата заряда при низкой интенсивности в дозиметрах на основе р-МОП транзисторов
10. 16.30-16.50
(20 мин.) **Ю.А. Кабальнов, А.Н. Качемцев, С.В. Оболенский**
Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова
Моделирование радиационных эффектов в транзисторах на КНС структурах

6 июня 2018 г.

11. 10.00-10.20 (20 мин.) **Э.Н. Вологдин**
АО «НПП «Пульсар»
Основы методологии прогнозирования стойкости кремниевых полупроводниковых приборов к воздействию импульсного нейтронного излучения
12. 10.30-10.50 (20 мин.) **М.Е. Черняк, А.А. Печенкин, А.В. Уланова, А.Ю. Никифоров, А.И. Чумаков, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Радиационные эффекты в фоточувствительных сенсорах. Методики и результаты исследования на стойкость к воздействию специальных факторов
13. 11.00-11.20 (20 мин.) **Д.В. Печенкина, Г.Г. Давыдов, М.П. Белова, А.С. Колосова, Л.Н. Кессаринский, Д.В. Бойченко, А.В. Яненко, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методические и технические средства оценки показателей стойкости вторичных источников питания к воздействию радиационных факторов космического пространства
14. 11.30-11.50 (20 мин.) **К.Е. Епифанцев, П.К. Скоробогатов, А.Н. Шемонаев, Н.С. Дятлов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Типовая методика испытаний на стойкость к воздействию одиночных импульсов напряжения. Влияние технологии и электрического режима на показатели импульсной электрической прочности

Перерыв 12.00-13.00 (кофе-брейк)

15. 13.00-13.20 (20 мин.) **Р.Г. Усеинов¹, Г.И. Зебрев², О.В. Мещуров¹, М.Г. Дроздецкий²**
¹АО «НИИП», ²НИЯУ МИФИ
Моделирование токов утечки в цифровой схеме DS18B20 при γ -облучении – пример использования модели глобальных утечек в КМОП ИС
16. 13.30-13.50 (20 мин.) **Е.Н. Некрасова¹, Е.В. Митин¹, Н.А. Иванов²**
¹ООО «НПЦ «Гранат», ²ФБГУ «ПИЯФ» НИЦ КИ
Исследование особенностей эффекта пробоя подзатворного диэлектрика в мощных МОП-транзисторах с использованием численного моделирования

17. 14.00-14.20 (20 мин.) **А.С. Петров, К.И. Таперо, В.Н. Улимов**
АО «НИИП»
Влияние повышенной температуры на деградацию БикМОП операционных усилителей при низкоинтенсивном облучении
18. 14.30-14.50 (20 мин.) **В.С. Анашин, Г.А. Протопопов, И.А. Ляхов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Возможность подтверждения требуемой стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ по данным испытаний на ВЭП

Перерыв 15.00-15.30 (кофе-брейк)

19. 15.30-15.50 (20 мин.) **К.Г. Сизова¹, М.О. Прыгунов², П.К. Скоробогатов³**
¹ООО «НПЦ «Топаз», ²ООО «О2 Световые системы»,
³НИЯУ МИФИ
Преимущество принципов системы управления надежностью для решения задач прогнозирования, обеспечения и оценки стойкости РЭА
20. 16.00-16.20 (20 мин.) **А.В. Грунин¹, С.А. Захарова²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ²СарФТИ НИЯУ МИФИ
Влияние импульсов давления в треках, образуемых тяжелыми заряженными частицами, на динамику неравновесных носителей заряда в полупроводниковых структурах
21. 16.30-16.50 (20 мин.) **М.В. Анохин^{1,6}, В.А. Арефьев⁶, В.И. Галкин², В.А. Дитлов⁴, А.Е. Дубов³, Л.М. Зелёный⁶, М.И. Панасюк¹, Б.П. Руткевич³, В.М. Чабанов⁵, И.В. Чулков⁶**
¹НИИЯФ МГУ, ²Физический факультет МГУ, ³СКБ КП ИКИ РАН,
⁴ИТЭФ, ⁵ИТЭТ, ⁶ИКИ РАН
Актуальные вопросы дозиметрии на космических аппаратах при решении задач стойкости электроники в поле ионизирующих частиц, образованных космическими лучами
22. 16.50-17.00 (10 мин.) **Н.С. Гаранин, О.Ф. Кухарчук, Е.Д. Полетаев, Е.В. Снигирёв, А.А. Суворов, О.Г. Фокина**
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Облучательная установка на базе ядерного реактора БАРС-6 для исследования стойкости радиоэлектронной аппаратуры и электрорадиоизделий к воздействию нейтронов и гамма-излучения

17.00-17.30

**Дискуссия, обсуждение стендовых докладов
Предложения в Решение конференции**

Стендовые доклады

- C1 **Г.П. Руднев¹, К.В. Литвицкий¹, В.А. Львович², Н.Г. Гамзатов³**
¹ГУП НПЦ «СПУРТ», ²АО «НПЦ «НИИМП», ³АО «НИИ «Субмикрон»
 Результаты испытаний функциональных узлов аппаратуры в условиях воздействия ИИ
- C2 **И.Ф. Бурлака, Г.Л. Пикалов, О.А. Николаев**
 ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России
 Верификация расчетной модели на реакторе ПРИЗ-М
- C3 **Ю.А. Кабальнов, А.Н. Качемцев, С.В. Оболенский**
 Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова
 Моделирование радиационных эффектов в транзисторах на КНС структурах
- C4 **А.А. Малышев, Р.В. Слабоус, Д.П. Соложенцев, Ф.В. Чубруков**
 ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
 Критичные режимы функционирования микросхем памяти FRAM-технологии в условиях воздействия специальных факторов
- C5 **С.В. Абрамов АО «НИИФИ»**
 К вопросу оценки точности определения поглощенных накопленных доз
- C6 **М.В. Анохин^{1,6}, В.А. Арефьев⁶, В.И. Галкин², В.А. Дитлов⁴, А.Е. Дубов³,
 Л.М. Зелёный⁶, М.И. Панасюк¹, Б.П. Руткевич³, В.М. Чабанов⁵, И.В. Чулков⁶**
¹НИИЯФ МГУ, ²Физический факультет МГУ, ³СБ КП ИКИ РАН, ⁴ИТЭФ,
⁵ИТЭТ, ⁶ИКИ РАН
 Актуальные вопросы дозиметрии на космических аппаратах при решении задач стойкости электроники в поле ионизирующих частиц, образованных космическими лучами
- C7 **Н.Н. Булгаков, В.Ф. Зинченко, Ю.А. Миршавка, С.А. Яхутин**
 АО «Российские космические системы»
 Повышение достоверности расчетов дозовых нагрузок на электронные компоненты в составе бортовой аппаратуры космических аппаратов
- C8 **В.Г. Хорошев, Ю.В. Киселёв, И.А. Лабутин**
 ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
 Возможности лаборатории 48 – комплекса с исследовательским ядерным реактором
- C9 **Д.Н. Литвин, А.Е. Чаунин, С.Л. Эльяш, А.Л. Юрьев, А.А. Селезнев**
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Исследование кратковременных сбоев ТТЛ микросхем, работающих в режиме автогенерации, при воздействии наносекундных импульсов рентгеновского излучения
- C10 **Д.Н. Литвин, А.Е. Чаунин, С.Л. Эльяш, А.Л. Юрьев, А.А. Селезнев**
 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Исследование функциональных сбоев аппаратуры диагностики высокотемпературной плазмы при воздействии наносекундных импульсов рентгеновского излучения

- C11 **И.Л. Бурцев, Т.Ю. Мамаева, А.К. Рыжаков, В.Я. Яцук**
АО «Восток»
Перспективные разработки ведущих производителей электронных компонентов для проектирования бортовой аппаратуры
- C12 **Э.Н. Вологдин**
АО «НПП «Пульсар»
Основы методологии прогнозирования стойкости кремниевых полупроводниковых приборов к воздействию импульсного нейтронного излучения
- C13 **М.С. Горбунов¹, А.А. Антонов¹, П.А. Монахов¹, В.С. Анашин², А.А. Кляйн², А.Е. Козюков², Э.Ф. Имамединов¹, Е.В. Марьяна¹**
¹ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ²Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Прямое экспериментальное сравнение КНИ КМОП микропроцессоров для определения эффективности методов борьбы с одиночными событиями
- C14 **Ю.В. Богатырев¹, С.Б. Ластовский¹, Д.А. Огородников¹, С.В. Шведов², В.А. Солодуха², Н.В. Алиева², Е.А. Иванюта²**
¹НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, ²ОАО «Интеграл»
Радиационное воздействие на параметры микросхемы цифрового датчика температуры и элементной базы
- C15 **Д.О. Ваничкин, И.Я. Гантман**
АО «НПП «Пульсар»
Влияние защитных диодов входных и выходных каскадов микросхем на их импульсную электрическую прочность при воздействии одиночных импульсов напряжения
- C16 **Н.С. Гаранин, О.Ф. Кухарчук, Е.Д. Полетаев, Е.В. Снигирёв, А.А. Суворов, О.Г. Фокина**
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
Облучательная установка на базе ядерного реактора БАРС-6 для исследования стойкости радиоэлектронной аппаратуры и электрорадиоизделий к воздействию нейтронов и гамма-излучения
- C17 **Э.Н. Вологдин, А.В. Левко, Д.С. Смирнов**
АО «НПП «Пульсар»
Результаты исследования стойкости кремниевых диодов Шоттки к дозовым эффектам
- C18 **Е.Н. Некрасова¹, Е.В. Митин¹, Н.А. Иванов²**
¹ООО «НПЦ «Гранат», ²ФБГУ «ПИЯФ» НИЦ КИ
Исследование особенностей эффекта пробоя подзатворного диэлектрика в мощных МОП-транзисторах с использованием численного моделирования
- C19 **А.Н. Труфанов**
Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова
Обеспечение радиационной стойкости оптоволоконной системы передачи энергии электронным устройствам

- C20 В.С. Першенков, И.И. Максимов, А.И. Жуков**
НИЯУ МИФИ
 Учет заряда радиационно-индуцированных акцепторных и донорных ловушек при расчете тока поверхностной рекомбинации биполярных транзисторов
- C21 А.С. Бакеренков¹, С.Б. Шмаков², В.А. Фелицын¹, А.С. Родин¹, А.Г. Петров², Д.В. Бойченко², В.С. Першенков¹, В.А. Телец²**
¹НИЯУ МИФИ, ²ИЭПЭ НИЯУ МИФИ
 Исследование дозовых радиационных эффектов в ПЗУ при различных интенсивностях
- C22 Н.А. Куликов, В.Д. Попов**
НИЯУ МИФИ
 Определение подвижности носителей заряда для исследования процесса дефектообразования в МОП транзисторах при длительном воздействии повышенной температуры
- C23 Е.С. Шалашова, И.А. Фатеев, О.С. Пивко, А.В. Александров, Д.В. Куликов, А.М. Галимов**
АО «НИИМА Прогресс»
 Монте-Карло моделирование сечения сбоев DICE-триггера в инструменте CRÈME-MC
- C24 А.М. Галимов^{1,3}, Г.А. Протопопов², И.А. Ляхов², В.С. Анашин², О.С. Пивко¹, А.В. Александров¹, Г.И. Зебрев³**
¹АО «НИИМА Прогресс», ²АО «ОРКК» - «НИИ КП», ³НИЯУ МИФИ
 Сравнительный расчет сечения сбоев от протонов по экспериментальным данным ТЗЧ
- C25 Н.А. Куликов¹, В.Д. Попов²**
¹ФГУП «НПЦАП им. академ. Н.А. Пилюгина», ²НИЯУ МИФИ
 Исследование процесса старения МОП транзисторов КМОП интегральных микросхем
- C26 А.С. Бакеренков, В.А. Фелицын, А.С. Родин, В.С. Першенков, Б.И. Подлепецкий, В.В. Беляков, Е.В. Петкович**
НИЯУ МИФИ
 Исследование дозовых радиационных эффектов в датчике температуры AD590
- C27 В.М. Кисель, А.Ю. Малявина, А.С. Бакеренков, В.А. Фелицын, А.С. Родин, В.С. Першенков**
НИЯУ МИФИ
 Исследование радиационной деградации источника опорного напряжения LM4050
- C28 А.С. Бакеренков, А.С. Родин, В.А. Фелицын, В.С. Першенков, Н.С. Глухов, В.В. Беляков**
НИЯУ МИФИ
 Исследование вольтамперных характеристик биполярных транзисторов общего назначения в широком диапазоне температур до и после радиационного воздействия

- С29 П.А. Зимин¹, В.С. Анашин¹, П.А. Чубунов¹, О.В. Мещуров², Р.Г. Усейнов^{2,3}, Г.И. Зебрев³**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²АО «НИИП», ³НИЯУ МИФИ
 Усиление скорости захвата заряда при низкой интенсивности в дозиметрах на основе р-МОП транзисторов
- С30 В.В. Шуренков**
 НИЯУ МИФИ
 Основные физические эффекты деградации полупроводниковых систем под действием электромагнитного импульса
- С31 Р.Г. Усейнов¹, Г.И. Зебрев², О.В. Мещуров¹, М.Г. Дроздецкий²**
¹АО «НИИП», ²НИЯУ МИФИ
 Моделирование токов утечки в цифровой схеме DS18B20 при γ -облучении – пример использования модели глобальных утечек в КМОП ИС
- С32 Р.Г. Усейнов¹, В.М. Ужegov²**
¹АО «НИИП», ²ФГУП «ЦНИИмаш»
 Методика оценки стойкости ИС к отказам от ТЗЧ в космическом пространстве по ограниченному набору экспериментальных данных для сечений защелок
- С33 Р.Г. Усейнов**
¹АО «НИИП»
 Развитие модели Dozier - Brown для выхода заряда в треке тяжелого иона путем учета электрического поля в окисле
- С34 О.В. Мещуров¹, Р.Г. Усейнов¹, А.Д. Артемов²**
¹АО «НИИП», ²АО «Корпорация «Комета»
 Результаты исследования МОП-детектора поглощенной дозы при воздействии низкоинтенсивного гамма-излучения
- С35 И.В. Соловьев, М.В. Жуков, А.И. Озеров**
 АО «НИИП»
 Специализированная электронная нагрузка для испытаний источников вторичного электропитания на стойкость к воздействию ионизирующих излучений
- С36 А.А. Сафьянов, С.А. Филатов, А.И. Озеров**
 АО «НИИП»
 Увеличение эффективности труда при испытаниях на моделирующих установках при использовании автоматизированного комплекса контроля и измерения параметров источников вторичного электропитания и линейных регуляторов напряжения
- С37 С.Н. Маслова-Зарецкая**
 АО «НИИП»
 Метрологическое обеспечение испытаний в АО «НИИП»
- С38 Н.В. Варламов¹, В.В. Кочергин², К.В. Лаврентьев², А.М. Членов²**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «НИИП»
 Определение характеристик высоковольтных импульсных конденсаторов

- C39 **Д.М. Иващенко, В.В. Кочергин**
АО «НИИП»
Мощный генератор Маркса с временем вывода энергии менее 1 мкс
- C40 **А.С. Петров, К.И. Таперо, В.Н. Улимов**
АО «НИИП»
Влияние повышенной температуры на деградацию БИКМОП операционных усилителей при низкоинтенсивном облучении
- C41 **С.К. Труфанов, А.И. Озеров, А.С. Петров**
АО «НИИП»
Исследование влияния электрического режима на радиационную стойкость NOR флеш-памяти
- C42 **М.В. Баньковский¹, В.М. Олухов¹, В.Ф. Герасимов²**
¹АО «НИИП», ²Филиал ФБУ «46 ЦНИИ» МО РФ
Метод оценки тока утечки в системах кабельных линий связи при воздействии импульсных ионизирующих излучений
- C43 **Е.В. Митин¹, А.И. Озеров²**
¹ООО «НПЦ «Гранат», ²АО «НИИП»
Исследование распределений уровней отказов по результатам испытаний больших объемов ЭКБ
- C44 **В.С. Анашин, Г.А. Протопопов, Е.В. Мрозовская**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Анализ методов интерпретации результатов испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C45 **В.С. Анашин, Г.А. Протопопов, Д.Г. Крылов, В.А. Юшкова**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Анализ условий эксплуатации бортовой аппаратуры в части ИИ КП, рассчитанных по отечественным и зарубежным моделям
- C46 **В.С. Анашин, Г.А. Протопопов, И.А. Ляхов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Возможность подтверждения требуемой стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ по данным испытаний на ВЭП
- C47 **П.А. Зимин¹, П.А. Чубунов¹, А.С. Петров²**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²АО «НИИП»
Результаты калибровки МНОП-дозиметров в диапазоне температур
- C48 **Е.В. Булаев, П.А. Зимин, П.А. Чубунов, А.Г. Базь**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Разработка аппаратуры контроля ионизирующего излучения космического пространства с использованием интерфейса SpaceWire

- C49 **А.С. Бычков¹, И.А. Ляхов¹, Г.А. Протопопов¹, С.В. Митрофанов², А.Т. Исатов²**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²ЛЯР ОИЯИ
Оценка погрешности расчета энергии ионов в месте расположения образцов при проведении испытаний ЭКБ на ИС ОЭ ВЭ-М
- C50 **К.С. Осипов, Р.П. Бабак, А.Е. Козюков, Т.В. Никольская**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Подготовка образцов ЭРИ для проведения испытаний на стойкость к воздействию ИИ КП
- C51 **П.А. Зимин**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Оценка факторов, определяющих точность калибровки р-МОП и МНОП дозиметров
- C52 **Ю.В. Гладышева, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, Л.Р. Арутюнян**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Результаты испытаний микросхем серии MC74 и SN74 на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C53 **К.Б. Бу-Хасан, В.С. Анашин, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, Т.А. Максименко, П.А. Чубунов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Зависимость ОБР транзисторов типа HEXFET при облучении ТЗЧ от отрицательной температуры
- C54 **С.В. Колпачков, С.А. Яковлев, А.Е. Козюков, В.В. Лыков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Результаты сравнительных исследований стойкости ADC08D500CIYB-NOPB к воздействию ТЗЧ и ВЭП
- C55 **Т.А. Максименко¹, А.Е. Козюков¹, С.А. Яковлев¹, А.А. Афанасьев²**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²АО «НПП «ЭлТом»
Результаты испытаний отечественных радиационно-стойких преобразователей напряжения на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C56 **Л.Р. Бакиров, П.А. Чубунов, С.Л. Воробьев, О.А. Бахирко**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Результаты расчета сечения эффекта SEU при облучении микросхем памяти ионами с «низкими» и «высокими» энергиями
- C57 **Л.Р. Бакиров, П.А. Чубунов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Сравнение характеристик чувствительности СОЗУ к воздействию ТЗЧ, полученных экспериментально-расчетными и экспериментальными методами
- C58 **В.В. Лыков, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, Т.С. Наполова**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Результаты испытаний 74LVT245DB на стойкость к воздействию ТЗЧ

- C59 **А.А. Калашникова, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, Р.Р. Мангушев**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Экспериментальные результаты контроля эффекта SET в операционных и инструментальных усилителях
- C60 **А.А. Калашникова, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, П.А. Чубунов, А.В. Нилов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Исследование зависимости параметров чувствительности операционных усилителей к воздействию ТЗЧ от отрицательной температуры
- C61 **А.А. Кляйн¹, А.Е. Козюков¹, С.А. Яковлев¹, М.Н. Смирнов², Т.В. Шилина²**
¹*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²АО НПЦ «ЭЛВИС»*
 Результаты испытаний MIPS32-совместимых 32-разрядных процессоров специального назначения на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц
- C62 **В.В. Лыков, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, Т.С. Наполова**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Результаты испытаний JSR164245SA на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C63 **А.Н. Шемонаев, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Экспериментальное исследование показателей импульсной электрической прочности в активном и пассивном режимах работы КМОП интегральных схем
- C64 **А.Н. Шемонаев, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Экспериментальное исследование влияния технологии сложно-функциональных БИС на показатели их импульсной электрической прочности
- C65 **Н.С. Дятлов, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Эффект накопления повреждений в изделиях микроэлектроники при воздействии серии электростатических разрядов
- C66 **О.А. Калашников, А.С. Каменева, А.Ю. Никифоров, В.А. Телец, А.В. Уланова, А.В. Кузьмин, А.Н. Щепанов, Н.В. Акишина, А.С. Фалин**
НИЯУ МИФИ, ФГУП «МНИИРИП»
 Опыт экспертиз документов по радиационной стойкости электронной компонентной базы
- C67 **Ю.М. Московская** *АО «ЭНПО СПЭЛС»*
 Базовые методические подходы к контролю соответствия готовой продукции требованиям в процессе серийного производства изделий микроэлектроники различных категорий радиационной стойкости
- C68 **М.П. Белова, Д.В. Печенкина, Г.Г. Давыдов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Влияние технологического разброса на показатели стойкости тестовых структур стабилизаторов напряжения к воздействию ионизирующего излучения

- C69 **А.С. Колосова, А.Р. Шарипова, А.С. Каменева, Д.В. Бойченко, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Различие кристаллов и радиационного поведения образцов различных партий микросхем приемопередатчиков иностранного производства
- C70 **А.Р. Шарипова, А.С. Колосова, А.Я. Борисов, О.А. Калашников**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Показатели дозовой стойкости цифровых логических микросхем производства Texas Instruments различных серий (КМОП и биполярного исполнения)
- C71 **Д.В. Печенкина, М.П. Белова, О.Ю. Винокуров, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Адаптация гибридных сборок вторичных источников питания к проведению исследований на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц
- C72 **Е.Ю. Внукова, М.П. Белова, Д.В. Печенкина, А.Я. Борисов, О.А. Калашников**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Влияние электрического режима на показатели стойкости линейных стабилизаторов напряжения
- C73 **М.П. Белова**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенности тиристорного эффекта в стабилизаторах напряжения по вспомогательным цепям задания режима работы
- C74 **Д.В. Савченков, А.А. Печенкин, О.В. Винокуров, Д.В. Печенкина, М.П. Белова, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Исследование тиристорных эффектов в стабилизаторах напряжения ф. Micrel в режиме «shutdown»
- C75 **М.Е. Коротеев, А.В. Демидова, Д.В. Бойченко, А.И. Чумаков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Влияние накопленной дозы на динамические характеристики супервизоров питания
- C76 **Г.Г. Давыдов, Д.В. Бойченко, Д.В. Печенкина, А.С. Тарараксин, Л.Н. Кессаринский, Т.Б. Крицкая, А.М. Полохов, Н.В. Акишина**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «Ангстрем», ФГУП «МНИИРИП»
Область безопасной работы Trench-Gate и Low-Charge полосковых мощных МОП транзисторов при воздействии тяжелых заряженных частиц
- C77 **М.Е. Коротеев, Н.А. Сычев, А.В. Демидова, Д.В. Бойченко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Аппаратно-программный комплекс для задания магнитного поля и контроля параметров чувствительности датчиков на эффекте Холла
- C78 **Д.В. Заворотнов, И.А. Горбатько, А.В. Демидова, А.Я. Борисов, Д.В. Бойченко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Деградация передаточной характеристики МЕМС-акселерометров вследствие накопленной дозы

- C79 **А.С. Тарараксин, Н.Е. Аристова, А.В. Мурыгин, Е.М. Глазунова, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Конструкционная адаптация микросборок кварцевых генераторов для проведения испытаний на стойкость к воздействию тяжелых заряженных частиц
- C80 **С.Б. Шамаков, А.Г. Петров, А.И. Чумаков, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Исследование одиночных отказов в ячейках SDRAM, вызванных воздействием протонного излучения, при изменении температуры и периода регенерации
- C81 **А.А. Печенкин, А.А. Новиков, М.М. Новикова, Д.В. Бобровский, Г.С. Сорокоумов, А.А. Орлов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», Филиал ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
Исследование одиночных радиационных эффектов в ПЛИС ф. Xilinx семейства Kintex-7 с проектными нормами 28 нм на лазерной установке
- C82 **А.И. Чумаков, Д.В. Бобровский, А.А. Печенкин, Д.В. Савченков, Г.С. Сорокоумов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Нестационарные тиристорные эффекты в КМОП ИС при воздействии ТЗЧ
- C83 **А.Н. Цирков, А.А. Печенкин, Д.Е. Протасов, А.Н. Новиков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Оценка параметров чувствительности ИС к воздействию ТЗЧ по тиристорному эффекту на фоне развивающегося катастрофического отказа
- C84 **Г.С. Сорокоумов, Д.В. Бобровский, А.Н. Новиков, Д.В. Савченков, А.А. Печенкин, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методические особенности разделения одиночных радиационных эффектов в современных ПЛИС
- C85 **А.О. Ахметов, Г.С. Сорокоумов, А.А. Смолин, Д.В. Бобровский, Д.В. Бойченко, В.М. Ужegov, А.Е. Шемяков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», ФГУП «ЦНИИмаш», ЗАО «ПРОТОМ»
Влияние толщины защиты КА на частоту одиночных сбоев от протонов низких энергий
- C86 **А.О. Ахметов, О.А. Калашников, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Анализ локальных дозовых нагрузок для малых КА CUBESAT
- C87 **А.А. Смолин, А.И. Чумаков, А.В. Сокоян, А.В. Яненко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методика прогнозирования частоты одиночных радиационных эффектов основанная на двухпараметрической модели
- C88 **К.А. Москаленко, В.А. Марфин, О.А. Калашников, А.И. Чумаков, С.А. Носков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», ФГУП «МНИИРИП»
Зависимость уровня бессбойной работы от тактовой частоты и напряжения питания современного СБИС процессора

- C89 **П.В. Некрасов^{1,2}, О.А. Калашников^{1,2}, Н.Д. Кравченко^{1,2}, Д.В. Бобровский^{1,2}, А.Г. Петров^{1,2}, А.А. Демидов^{1,2}, А.Ю. Никифоров^{1,2}, С.С. Шумилин³, Р.Р. Домбровский³, А.Б. Однолько³, А.Б. Макаров³, Тенишев В.П.**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³АО «ПКК Миландр», ⁴ФГУП «ВНИИФТРИ»
Результаты использования технологии КМОП КНИ 180 нм (X-FAB) при разработке радиационно-стойкой ЭКБ
- C90 **Н.Д. Кравченко, П.В. Некрасов, Д.В. Бойченко, М.Ю. Лопарёв, С.С. Шумилин, А.Н. Кравчук**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «ПКК Миландр»
Исследование радиационной стойкости микроконтроллера 1986BE8T с архитектурой ARM
- C91 **И.И. Швецов-Шиловский, А.Г. Петров, А.Б. Борудина, А.В. Уланова, В.А. Вавилов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Зависимость тока потребления от напряжения питания микросхем КМОП КНИ со встроенным генератором отрицательного смещения при дозовом воздействии
- C92 **Д.В. Бобровский, А.А. Печенкин, А.И. Чумаков, Г.С. Сорокоумов, А.Н. Цирков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Скрытые повреждения в микросхемах как результат возникновения одиночного тиристорного эффекта
- C93 **Д.С. Костюченко, А.Б. Каракозов, П.В. Некрасов, А.В. Уланова, О.А. Калашников**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенности организации цепи питания сложно-функциональных СБИС во время проведения радиационных исследований
- C94 **А.Н. Цирков, А.А. Печенкин, Г.В. Чуков, А.Н. Щепанов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», ФГУП «МНИИРИП»
Методические особенности регистрации ТЭ в программируемых СВЧ интегральных схемах
- C95 **Д.И. Сотсков, И.О. Метелкин, В.В. Елесин, Н.А. Усачев**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Апробация подхода радиационно-ориентированного проектирования СВЧ функциональных блоков широкополосных синтезаторов частот на основе гетероструктурных биполярных транзисторов
- C96 **И.О. Метелкин, Н.А. Усачев, В.В. Елесин, Д.И. Сотсков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методика идентификации параметров радиационно-ориентированной модели гетеробиполярных транзисторов, учитывающей структурные повреждения
- C97 **М.И. Титова, К.М. Амбуркин, И.М. Губина, А.Н. Щепанов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», ФГУП «МНИИРИП»
Комбинированная оснастка для испытаний некорпусированных изделий ТСВЧЭ

- C98 **Н.В. Шеремета, К.М. Амбуркин, Г.В. Чуков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Программное обеспечение автоматизации испытаний изделий ТСВЧЭ при воздействии импульсного ионизирующего излучения
- C99 **К.М. Амбуркин, Г.В. Чуков, Г.Н. Назарова, А.В. Телец**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС, АО «НПП «Пульсар»
 Уменьшение диапазона рабочих напряжений СВЧ транзисторов на основе GaN при воздействии ТЗЧ
- C100 **Н.А. Усачев, В. В. Елесин, Г.Н. Назарова, Д.И. Сотсков, Г.В. Чуков, К.М. Амбуркин, Н.М. Жидков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Показатели радиационной стойкости усилительных и генераторных СВЧ КМОП КНИ функциональных блоков приемопередающих БИС
- C101 **Е.А. Меховский, А.А. Печенкин, Ю.М. Московская, О.А. Макридина, Д.Н. Калбазов**
АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «Зеленоградский нанотехнологический центр»
 Локализация критичных к тиристорному эффекту областей топологии макетных образцов СБИС с использованием лазерного источника как способ повышения стойкости опытных образцов
- C102 **Ю.М. Московская, Г.С. Сорокоумов, Е.А. Меховский, О.А. Макридина, В.А. Вавилов, Е.А. Трудновская**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», НПК «ТЦ» МИЭТ, АО «НИИМЭ», АО «Анестрем»
 Оценка влияния схемно-топологических коррекций кристаллов на значения лазерных калибровочных коэффициентов при контроле производственных партий пластин по эффектам мощности дозы
- C103 **П.С. Громова, Г.Г. Давыдов, Л.Н. Кессаринский, А.Ю. Никифоров, А.И. Михайлов, В.В. Лучинин, А.В. Афанасьев**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
 Эффекты мощности дозы в высотных мощных транзисторах на 4H-SiC
- C104 **А.О. Ширин, Д.В. Печенкина, А.Я. Борисов, Л.Н. Кессаринский**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Влияние температурного режима на дозовую стойкость микросхем высоковольтных драйверов иностранного производства
- C105 **В.А. Марфин, П.В. Некрасов, О.А. Калашников, Д.В. Бойченко, А.Н. Щепанов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», ФГУП «МНИИРИП»
 Моделирование зависимости $U_{in}(f)$ сложно-функциональных СБИС тестовой структурой цепочки КМОП инверторов
- C106 **А.А. Демидов, О.А. Калашников, А.В. Уланова, Д.В. Бойченко, Н.С. Александров, А.Л. Потапов, И.Б. Яшанин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова
 Влияние частоты тактирования и температуры среды на уровень стойкости АЦП на переключаемых конденсаторах

- C107 **М.Е. Черняк, Е.В. Раннева, А.В. Уланова, А.Ю. Никифоров, А.И. Верижников, А.М. Цырлов, В.С. Федосов, А.Н. Щепанов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «Протон», ФГУП «МНИИРИП»
 Использование рентгеновского источника для локализации чувствительной области кристалла оптрона
- C108 **М.Е. Черняк, А.А. Печенкин, А.В. Уланова, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Радиационные эффекты в фоточувствительных сенсорах, методики и результаты исследований
- C109 **Р.К. Можаяев, М.Е. Черняк, А.А. Печенкин, Д.В. Бойченко, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Исследование пробоя в ПЗС-сенсоре при воздействии тяжелых заряженных частиц
- C110 **Р.К. Можаяев, М.Е. Черняк, А.А. Печенкин, А.В. Уланова, В.В. Щербаков, Е.А. Степанов, Н.В. Акишина**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «Центр ВОСПИ», ФГУП «МНИИРИП»
 Исследование эффектов мощности дозы в вертикально-излучающем лазере
- C111 **Д.С. Уколов, Р.К. Можаяев, А.А. Печенкин, М.Е. Черняк**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Исследование затухания оптического сигнала в одномодовом радиационно-стойком фторосодержащем оптоволокне при воздействии импульсного электронного излучения
- C112 **Д.С. Уколов, О.Б. Маврицкий, А.Н. Егоров, А.А. Печенкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Практический опыт применения кремниевых твердотельных иммерсионных линз для повышения разрешающей способности лазерных установок
- C113 **В.С. Фигуров, В.В. Байков, А.С. Артамонов, К.М. Амбуркин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Исследование характеристик импульса тормозного излучения моделирующей установки на основе электронного ускорителя АРСА
- C114 **В.С. Фигуров** *НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»*
 Методика оценки погрешности калибровочного коэффициента при проведении испытаний изделий электронной техники с использованием лазерных источников ионизирующего излучения
- C115 **К.Г. Сизова¹, М.О. Прыгунов², Н.А. Иванов³**
¹ООО «НПЦ «Гранат», ²ООО «О2 Световые системы», ³ПИЯФ НИЦ КИ
 Анализ радиационной стойкости РЭА к воздействию ОЯЧ КП по одиночным эффектам на основе результатов испытаний в составе аппаратуры и поэлементно
- C116 **К.Г. Сизова¹, М.О. Прыгунов², П.К. Скоробогатов³**
¹ООО «НПЦ «Топаз», ²ООО «О2 Световые системы», ³НИЯУ МИФИ
 Преимущество принципов системы управления надежностью для решения задач прогнозирования, обеспечения и оценки стойкости РЭА

- C117 **Т.В. Кулевой, С.В. Рогожкин, Н.Н. Алексеев, В.С. Столбунов, А.А. Никитин**
ФГБУ «ИТЭФ» НИЦ КИ
Экспериментальный комплекс НИЦ "Курчатовский институт" - ИТЭФ для анализа радиационной повреждаемости материалов
- C118 **В.С. Анашин, П.А. Чубунов, А.Е. Козюков, А.С. Бычков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Специфика испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ в условиях модернизации ускорителей ионов
- C119 **В.Н. Гульбин, Н.С. Колпаков**
АО «ИМЦ Концерн «Вега»
Радио- и радиационно-защитные полимерные нанокompозиты
- C120 **О.А. Галихина, А.Н. Залялов, С.А. Лазарев**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Использование программ метода Монте-Карло для расчетов поглощенных доз лучевым методом
- C121 **А.В. Грунин¹, С.А. Захарова²**
¹ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ²СарФТИ НИЯУ МИФИ
Влияние импульсов давления в треках, образуемых тяжелыми заряженными частицами, на динамику неравновесных носителей заряда в полупроводниковых структурах
- C122 **Н.Г. Гамзатов¹, Г.П. Руднев², К.В. Литвицкий²**
¹АО «НИИ «Субмикрон», ²АО «Концерн радиостроения «Вега»
К вопросу об оптимизации обеспечения радиационной стойкости космической аппаратуры по ионизационным дозовым эффектам
- C123 **В.В. Кравчук, И.В. Евсеев**
Военная академия РВСН имени Петра Великого
Методический подход к оценке стойкости радиоэлектронной аппаратуры летательного аппарата при воздействии импульсного ионизирующего излучения

Участники конференции «Стойкость-2018»

	Ф.И.О.	Должность	Место работы
1.	Абрамов Александр Игоревич	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
2.	Абрамов Сергей Владимирович	Ведущий инженер	АО «НИИФИ» г. Пенза
3.	Алаев Дмитрий Александрович	Инженер 2 категории	АО «ПКК Миландр» г. Москва
4.	Алферов Сергей Николаевич	Начальник отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
5.	Амбуркин Константин Михайлович	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
6.	Анашин Василий Сергеевич	Заместитель руководителя	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
7.	Андреянов Денис Александрович	Инженер-исследователь 3 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
8.	Анохин Михаил Всеволодович	Зав. физико-технической лабораторией, к.ф.-м.н.	ИКИ РАН г. Москва
9.	Антонов Андрей Александрович	Заведующий отделом	ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН г. Москва
10.	Арабян Севада Геворгович	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
11.	Арифуллина Гузалия Ростямовна	Инженер отдела надежности	АО «УКБП» г. Ульяновск
12.	Артемов Александр Дмитриевич	Начальник сектора	АО «Корпорация «Комета» г. Москва
13.	Афанасьев Андрей Александрович	Ведущий инженер электроник	АО «НПП «ЭлТом» пос. Томилино, Московская обл.
14.	Афанасьев Игорь Викторович	Ведущий инженер- конструктор	МНПК «Авионика» г. Москва
15.	Афанасьев Дмитрий Викторович	Ведущий инженер- исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
16.	Ахметов Алексей Олегович	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
17.	Ахметов Руслан Раисович	Ведущий специалист отдела надежности и отказобезопасности	АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» г. Дубна
18.	Бакеренков Александр Сергеевич	Доцент кафедры 27	НИЯУ МИФИ г. Москва
19.	Баньковский Максим Владимирович	Ведущий инженер- испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино

20.	Баранова Татьяна Алексеевна	Инженер-физик	АО «НИИП» г. Лыткарино
21.	Барсемян Георгий Гарикович	Техник	АО «Российские космические системы» г. Москва
22.	Белецкий Сергей Александрович	Ведущий инженер	АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж
23.	Белова Майя Павловна	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
24.	Бесецкий Алексей Валерьевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
25.	Блинова Анна Владимировна	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
26.	Бобков Денис	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
27.	Бобровский Дмитрий Владимирович	Начальник НТК-2, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
28.	Бойченко Дмитрий Владимирович	Генеральный директор, к.т.н., доцент	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
29.	Болдырева Лилия Валерьевна	Младший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
30.	Болотин Игорь Сергеевич	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
31.	Борисов Алексей Яковлевич	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
32.	Борисов Алексей Сергеевич	Ведущий инженер	АО «НПЦ ЭлТест» г. Санкт-Петербург
33.	Боруздина Анна Борисовна	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
34.	Брагин Алексей Александрович	Инженер-конструктор 2 категории	АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара
35.	Бурцев Игорь Леонидович	Руководитель направления «Космос», к.т.н.	АО «Восток» г. Санкт-Петербург
36.	Бутин Валентин Иванович	Начальник научно- исследовательского отдела	ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» г. Москва
37.	Ваничкин Денис Олегович	Инженер	АО «НПП «Пульсар» г. Москва
38.	Варламов Николай Викторович	Доцент	НИЯУ МИФИ г. Москва
39.	Василегин Борис Владимирович	Старший научный сотрудник	ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН г. Москва
40.	Васильчук Наталья Александровна	Инженер	АО «НИИ «Феррит- Домен» г. Санкт-Петербург

41.	Васькин Роман Евгеньевич	Техник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
42.	Ватуев Александр Сергеевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
43.	Виноградов Анатолий Константинович	Руководитель проекта	АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж
44.	Винокуров Олег Юрьевич	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
45.	Внукова Евгения Юрьевна	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
46.	Волныкин Александр Николаевич	Инженер-конструктор 1 категории	АО «РКЦ «Прогресс» г. Самара
47.	Вологдин Эрих Николаевич	Старший научный сотрудник	АО «НПП «Пульсар» г. Москва
48.	Володин Павел Владимирович	Техник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
49.	Галихина Ольга Алексеевна	Инженер-исследователь	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
50.	Гамзатов Нариман Гамзевич	Ведущий инженер	АО «НИИ «Субмикрон» г. Москва, г. Зеленоград
51.	Гаранин Никита Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» г. Обнинск Калужской обл.
52.	Гвоздев Роман	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
53.	Герасимов Владимир Федорович	Старший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
54.	Героев Алексей Владимирович	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
55.	Глазкин Дмитрий Николаевич	Ведущий инженер	ИКИ РАН г. Москва
56.	Глазунова Екатерина Михайловна	Техник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
57.	Глухов Никита Сергеевич	Студент	НИЯУ МИФИ г. Москва
58.	Голованов Степан Валерьевич	Инженер-исследователь 3 категории	АО «Российские космические системы» г. Москва
59.	Голубцов Артем Александрович	Инженер-исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
60.	Гончаров Андрей Васильевич	Начальник бригады надежности, спецстойкости и сертификации	АО «Аэрозлектромаш» г. Москва
61.	Горбатько Иван Александрович	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

62.	Гордейчук Эдуард Олегович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
63.	Горелов Андрей Александрович	Заместитель начальника отдела	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
64.	Громов Дмитрий Викторович	Главный научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
65.	Громова Полина Сергеевна	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
66.	Грунин Анатолий Васильевич	Главный научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
67.	Губина Ирина Михайловна	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
68.	Гульбин Виктор Николаевич	Начальник отдела	АО «ИМЦ Концерна «Вега» г. Москва
69.	Гуськов Виталий Иванович	Старший научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
70.	Давыдов Георгий Георгиевич	Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
71.	Даньшин Денис Александрович	Начальник	537 ВП МО РФ г. Лыткарино
72.	Демидов Александр Алексеевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
73.	Демидова Александра Владимировна	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
74.	Дергачёв Антон Геннадьевич	Ведущий инженер	АО «НПК «СПП» г. Москва
75.	Деревянко Юрий Борисович	Ведущий инженер- испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
76.	Дороднов Сергей Викторович	Начальник БНП	ОАО «КБ Электроприбор» г. Саратов
77.	Дубровский Алексей Георгиевич	Начальник отдела	АО «Российские космические системы» г. Москва
78.	Дьяков Артем Анатольевич	Заместитель главного инженера	АО «Корпорация «Комета» г. Москва
79.	Дятлов Николай Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
80.	Егоров Алексей Юрьевич	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
81.	Елесин Вадим Владимирович	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
82.	Емельянов Владимир Владимирович	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
83.	Епифанцев Константин Алексеевич	Научный сотрудник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва

84.	Ермилова Наталья Сергеевна	Начальник лаборатории	АО «ПКК Миландр» г. Москва
85.	Ефаров Александр Алексеевич	Ведущий инженер	АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» г. Заречный
86.	Жаковская Татьяна Васильевна	Главный специалист	АО «ВНИИРТ» г. Москва
87.	Жаров Алексей Николаевич	Начальник испытательной лаборатории	ООО «Радиокомп» г. Москва
88.	Жиляева Виктория Владимировна	Ведущий инженер	АО «НИИ «Феррит- Домен» г. Санкт-Петербург
89.	Жуков Михаил Викторович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
90.	Жуков Александр Иванович	Студент	НИЯУ МИФИ г. Москва
91.	Забродский Анатолий Хананович	Начальник группы	АО «НПК «СПП» г. Москва
92.	Заворотнов Дмитрий Владимирович	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
93.	Зебрев Геннадий Иванович	Профессор кафедры 27	НИЯУ МИФИ г. Москва
94.	Зимин Петр Алексеевич	Инженер исследователь	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
95.	Иванова Наталья Викторовна	Техник 1 категории	АО «НИИП» г. Лыткарино
96.	Иващенко Дмитрий Михайлович	И.О. начальника управления	АО «НИИП» г. Лыткарино
97.	Ильин Александр Федорович	Ведущий инженер- исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
98.	Кабальнов Юрий Аркадьевич	Ведущий научный сотрудник	Филиал ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород
99.	Казаков Вячеслав Васильевич	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
100.	Калашников Олег Арсеньевич	Заместитель генерального директора по испытаниям, к.т.н., доцент	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
101.	Калашникова Анастасия Андреевна	Инженер исследователь	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
102.	Каленов Владимир Геннадьевич	Советник	АО «Российские космические системы» г. Москва
103.	Кандрунин Владимир Евгеньевич	Начальник отдела	АО «НПК «СПП» г. Москва

104.	Капослез Владислав Алексеевич	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
105.	Каракозов Андрей Борисович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
106.	Карпухин Владимир Михайлович	Инженер 1 категории	АО «ПНИЭИ» г. Пенза
107.	Кашеев Дмитрий Николаевич	Руководитель отдела атомной энергетики	ООО «КРОНЕ Инжиниринг» г. Самара
108.	Киндяков Евгений Борисович	Ведущий инженер- конструктор	Филиал ООО «ИРЗ» КБ «Робототехника» г. Москва
109.	Кириллов Алексей Владимирович	Оператор пульта УЗЧ	АО «НИИП» г. Лыткарино
110.	Клишин Александр Владимирович	Заведующий сектором	ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН г. Москва
111.	Клыков Антон Владимирович	Заместитель начальника отдела ВВФ и испытаний	АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» г. Дубна
112.	Кобелева Алёна Алексеевна	Инженер	ИКИ РАН г. Москва
113.	Козюков Александр Евгеньевич	Начальник отдела	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
114.	Колесников Константин Анатольевич	Ведущий инженер	АО «Российские космические системы» г. Москва
115.	Колосова Анна Сергеевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
116.	Копылов Валерий Андреевич	Заместитель начальника отдела	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
117.	Коротеев Михаил Евгеньевич	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
118.	Коротенко Владимир Алексеевич	Начальник отдела	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
119.	Костенко Александра Сергеевна	Техник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
120.	Костин Алексей Сергеевич	Инженер-исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
121.	Костюченко Денис Сергеевич	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
122.	Котов Дмитрий Константинович	Ведущий специалист	537 ВП МО РФ г. Лыткарино
123.	Кочемасов Дмитрий Викторович	Заместитель начальника испытательной лаборатории	ООО «Радиокомп» г. Москва

124.	Кочергин Владимир Васильевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
125.	Кравченко Николай Дмитриевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
126.	Кравчук Владимир Викторович	Адьюнкт	Военная академия РВСН им. Петра Великого г. Балашиха
127.	Криницкий Александр Васильевич	Старший научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
128.	Кузённый Сергей Владимирович	Инженер по атомной энергетике	ООО «КРОНЕ- Автоматика» г. Самара
129.	Кузьмичев Олег Владимирович	Заместитель главного контролера по РЭА	АО «ПКК Миландр» г. Москва
130.	Куликов Никита Андреевич	Инженер 2 категории	ФГУП «НПЦАП» г. Москва
131.	Лабутин Иван Александрович	Начальник службы СУЗ и КИПиА ИЯР	ФГУП «Крыловский государственный научный центр» г. Санкт-Петербург
132.	Лаврентьев Константин Владимирович	Ведущий научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино
133.	Лагов Петр Борисович	Начальник отдела	АО «Российские космические системы» г. Москва
134.	Левко Алексей Владимирович	Инженер	АО «НПП «Пульсар» г. Москва
135.	Липский Алексей Константинович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
136.	Литвин Дмитрий Никитович	Заместитель начальника отделения 1330	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров, Нижегородская обл.
137.	Литвицкий Константин Владимирович	Ведущий инженер	Филиал АО «РКЦ «Прогресс» НПП «ОПТЭКС» г. Москва, г. Зеленоград
138.	Лойко Юрий Сергеевич	Инженер-физик	АО «НИИП» г. Лыткарино
139.	Лоскутов Илья Олегович	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
140.	Лукошков Борис Владимирович	Заместитель начальника	537 ВП МО РФ г. Лыткарино
141.	Лыков Владислав Владимирович	Инженер исследователь	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
142.	Ляхов Игорь Андреевич	Инженер исследователь	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва

143.	Мавлюдов Тимур Булатович	Инженер по КИПиА	АО «НИИП» г. Лыткарино
144.	Макаренко Александр Владимирович	Заместитель начальника отдела	ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» г. Москва
145.	Макаров Александр Борисович	Главный специалист	АО «ПКК Миландр» г. Москва
146.	Макридина Олеся Анатольевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
147.	Максименко Тимофей Александрович	Инженер исследователь	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
148.	Максимов Иван Игоревич	Студент	НИЯУ МИФИ г. Москва
149.	Марфин Владимир Александрович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
150.	Марченко Михаил Владимирович	Начальник отдела 443	ФГУП МОКБ «Марс» г. Москва
151.	Марчук Виктория Анатольевна	Инженер II категории	ФГУП «ЦНИИмаш» г. Королев
152.	Маслова-Зарецкая Светлана Николаевна	Главный метролог	АО «НИИП» г. Лыткарино
153.	Матанский Кирилл Владимирович	Инженер-исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
154.	Махиня Алексей Николаевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
155.	Машков Павел Леонидович	Инженер	АО «ВЗПП-С» г. Воронеж
156.	Мельников Дмитрий Александрович	Начальник отдела	Главное управление Вооружения ВС РФ
157.	Мещуров Олег Викторович	Ведущий инженер- испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
158.	Мирофанова Евгения Николаевна	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
159.	Митин Евгений Викторович	Нач. отдела радиационных и ресурсных испытаний	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
160.	Михайлов Андрей Львович	Инженер 1 категории	АО «НИИ командных приборов» г. Санкт-Петербург
161.	Можаев Иван Андреевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
162.	Можаев Роман Константинович	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
163.	Монахова Елена Владимировна	Инженер по метрологии	АО «НИИП» г. Лыткарино

164.	Москаленко Кирилл Андреевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
165.	Москвич Петр Владимирович	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
166.	Московская Юлия Марковна	Старший научный сотрудник - Руководитель группы	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
167.	Муранов Дмитрий Алексеевич	Инженер по КИПиА	АО «НИИП» г. Лыткарино
168.	Мурзин Вадим Юрьевич	Начальник сектора	АО «Российские космические системы» г. Москва
169.	Мурзов Борис Петрович	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
170.	Мурыгин Артем Владимирович	Техник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
171.	Мусалитин Александр Александрович	Научный сотрудник	АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г. Москва
172.	Назаренко Михаил Владимирович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
173.	Назарова Галина Николаевна	Старший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
174.	Некрасов Павел Владимирович	Ведущий научный сотрудник, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
175.	Некрасова Екатерина Николаевна	Инженер-исследователь	ООО «НПЦ «Гранат» г. Санкт-Петербург
176.	Нестеренко Александр Евгеньевич	Ведущий инженер-испытатель	ФГУП «НИИП» г. Лыткарино
177.	Никифоров Александр Юрьевич	Заместитель директора	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
178.	Никонов Виталий Валериевич	Инженер 2 категории	АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург
179.	Новиков Александр Анатольевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
180.	Новикова Марина Михайловна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
181.	Новова Анастасия Валерьевна	Инженер	ФГУП МОКБ «Марс» г. Москва
182.	Ноздрин Дмитрий Анатольевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
183.	Озеров Александр Иванович	Начальник управления радиационных испытаний	АО «НИИП» г. Лыткарино
184.	Олухов Вячеслав Михайлович	Главный научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино

185.	Павлов Николай Александрович	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
186.	Парфенова Наталья Леонидовна	Начальник отдела	АО «Концерн «Созвездие» г. Воронеж
187.	Першенков Вячеслав Сергеевич	Заведующий кафедрой 27, профессор	НИЯУ МИФИ г. Москва
188.	Першина Евгения Олеговна	Ведущий инженер	АО «Корпорация «Комета» г. Москва
189.	Петров Андрей Григорьевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
190.	Петров Александр Сергеевич	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
191.	Петров Михаил Сергеевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
192.	Печенкин Александр Александрович	Начальника НТК-4, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
193.	Печенкина Дарья Витальевна	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
194.	Пономаренко Алексей Михайлович	Старший инженер по испытаниям	АО «НПП «ЭлТом» пос. Томилино, Московская обл.
195.	Попов Александр Юрьевич	Инженер 2 категории	АО НПК «Северная заря» г. Санкт-Петербург
196.	Попов Виктор Дмитриевич	Профессор кафедры 27	НИЯУ МИФИ г. Москва
197.	Посысаев Евгений Иванович	Ведущий научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
198.	Потеряева Елена Николаевна	Ведущий инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
199.	Протасов Дмитрий Евгеньевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
200.	Протопопов Григорий Александрович	Начальник сектора	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
201.	Раннева Екатерина Владимировна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
202.	Рогожкин Сергей Васильевич	Начальник отдела	ФГБУ «ИТЭФ» НИЦ «Курчатовский институт» г. Москва
203.	Родин Александр Сергеевич	Аспирант кафедры 27	НИЯУ МИФИ г. Москва
204.	Романенко Алексей Александрович	Инженер	АО «НИИП» г. Лыткарино
205.	Романенко Владимир Михайлович	Ведущий инженер- испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино

206.	Рубанов Павел Владимирович	Зав. лабораторией, к.т.н.	НИ ТПУ г. Томск
207.	Руденков Андрей Евгеньевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
208.	Рудковский Юрий Анатольевич	Заместитель главного конструктора	АО «УКБП» г. Ульяновск
209.	Рябев Алексей Николаевич	Инженер-исследователь	АО «Российские космические системы» г. Москва
210.	Савченков Дмитрий Владимирович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
211.	Сапожников Вячеслав Анатольевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
212.	Саушин Павел Николаевич	Начальник конструкторского бюро	ООО «ИРЗ» г. Ижевск
213.	Сафьянов Алексей Анатольевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
214.	Семенец Борис Николаевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
215.	Семенов Владимир Тимофеевич	Ведущий специалист	АО «Корпорация «ВНИИЭМ» г. Москва
216.	Сергеев Сергей Юрьевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
217.	Сидоров Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника отдела, к.т.н.	АО «НПП «Пульсар» г. Москва
218.	Сизова Ксения Геннадьевна	Технический директор	ООО «НПЦ «Топаз» г. Санкт-Петербург
219.	Скоробогатов Михаил Анатольевич	Ведущий инженер	АО «ЦНИИАГ» г. Москва
220.	Скоробогатов Петр Константинович	Главный научный сотрудник, д.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
221.	Смирнов Вадим Владимирович	Ведущий инженер- конструктор	АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» г. Дубна
222.	Смолин Анатолий Александрович	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
223.	Согоян Армен Вагоевич	Ведущий научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
224.	Соловьев Илья Валерьевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
225.	Сорокоумов Георгий Сергеевич	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
226.	Сотсков Денис Иванович	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
227.	Стрельников Олег Евгеньевич	Инженер по испытаниям	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров

228.	Сычев Николай Юрьевич	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
229.	Таперо Константин Иванович	Заместитель генерального директора по инновациям и производству, д.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
230.	Телец Виталий Арсеньевич	Директор	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
231.	Тимофеев Дмитрий Валерьевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
232.	Титов Кирилл Игоревич	Ведущий инженер	ИКИ РАН г. Москва
233.	Титова Мария Игоревна	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
234.	Торшин Роман Сергеевич	Техник	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
235.	Труфанов Сергей Константинович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
236.	Труфанов Алексей Николаевич	Начальник научно- исследовательского отдела	Филиал ФГУП «РФЯЦ- ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова г. Нижний Новгород
237.	Ужегов Вячеслав Михайлович	Ведущий научный сотрудник	ФГУП «ЦНИИмаш» г. Королев
238.	Уколов Денис Сергеевич	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
239.	Уланова Анастасия Владиславовна	Ведущий научный сотрудник, к.т.н., доцент	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
240.	Улимов Виктор Николаевич	Заместитель генерального директора по науке, д.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
241.	Ульянов Сергей Петрович	Начальник конструкторского бюро	Филиал ООО «ИРЗ» КБ «Робототехника» г. Москва
242.	Усачев Николай Александрович	Научный сотрудник, к.т.н., доцент	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
243.	Усеинов Рустэм Галеевич	Ведущий научный сотрудник	АО «НИИП» г. Лыткарино
244.	Усманов Ренат Рифович	Ведущий инженер- конструктор	ООО «ИРЗ» г. Ижевск
245.	Фазиллов Давид Эрганович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
246.	Федюкевич Василий Альбертович	Инженер по испытаниям 3 категории	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров, Нижегородская обл.
247.	Фелицын Владислав Александрович	Аспирант кафедры 27	НИЯУ МИФИ г. Москва

248.	Фигуров Валерий Сергеевич	Ведущий инженер	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
249.	Филатов Сергей Анатольевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
250.	Филимонов Александр Владимирович	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
251.	Фокин Григорий	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
252.	Харченко Максим Эдуардович	Инженер	АО «ВЗПП-С» г. Воронеж
253.	Хаустов Виталий Васильевич	Ведущий научный сотрудник	ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ г. Мытищи
254.	Цирков Артем Николаевич	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
255.	Чаунин Антон Евгеньевич	Начальник лаборатории 1335-1	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров, Нижегородская обл.
256.	Чепов Вячеслав	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
257.	Черняк Максим Евгеньевич	Младший научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
258.	Чиякин Александр Николаевич	Инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
259.	Членов Александр Михайлович	Генеральный директор, к.т.н.	АО «НИИП» г. Лыткарино
260.	Чубруков Фёдор Владимирович	Ведущий инженер	ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» г. Москва
261.	Чубунов Павел Александрович	Начальник отдела	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
262.	Чуков Георгий Викторович	Ведущий научный сотрудник – Заместитель начальника НТК-3	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
263.	Чумаков Александр Иннокентьевич	Главный научный сотрудник – главный эксперт, д.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
264.	Шарипова Аделия Рамильевна	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
265.	Швецов-Шиловский Иван Иванович	Научный сотрудник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
266.	Шелковников Виктор Васильевич	Ведущий инженер-испытатель	АО «НИИП» г. Лыткарино
267.	Шемонаев Александр Николаевич	Инженер-исследователь	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
268.	Шемякин Сергей Петрович	Ведущий инженер-конструктор	ООО «ИРЗ» г. Ижевск

269.	Шеремета Никита Владимирович	Техник	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
270.	Ширин Алексей Олегович	Стажер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
271.	Шмаков Сергей Борисович	Инженер-исследователь	ИЭПЭ НИЯУ МИФИ г. Москва
272.	Шудра Денис Викторович	Начальник отдела	АО «НИИП» г. Лыткарино
273.	Шумилин Сергей Сергеевич	Директор ЦП ИС	АО «ПКК Миландр» г. Москва
274.	Эльяш Света Львовна	Ведущий научный сотрудник	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров
275.	Яковлев Сергей Александрович	Начальник группы	Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП» г. Москва
276.	Яненко Андрей Викторович	Технический директор, к.т.н.	АО «ЭНПО СПЭЛС» г. Москва
277.	Яшин Егор Андреевич	Инженер по поверке СИ ИИ	АО «НИИП» г. Лыткарино